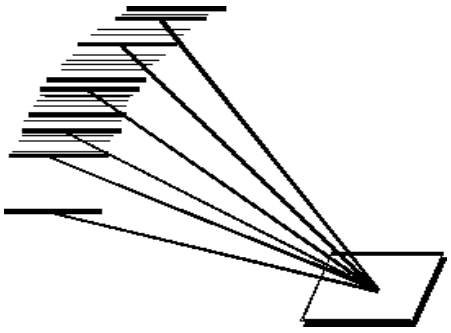
FH MÜNSTER
University of Applied Sciences

DAAS Deutscher Arbeitskreis für Analytische Spektroskopie

31. Anwendertreffen Röntgenfluoreszenz- und Funkenemissionsspektrometrie

Technologie-Campus
Steinfurt

03. – 04. März 2026



Die FH Münster veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Arbeitskreis für Analytische Spektroskopie (DAAS) ein Treffen von Anwendern der Röntgenfluoreszenz- und Funkenemissionsspektrometrie sowie verwandter Methoden der Feststoffanalyse.
Ziel des Anwendertreffens ist es, Forschung und Industrie zusammenzuführen, um den Informationsaustausch zu fördern und neue Entwicklungen anzuregen. In Kurzvorträgen wird über instrumentelle Neuentwicklungen, Lösungen aktueller Fragestellungen und insbesondere über den Einsatz dieser Methoden in Laboratorien verschiedener Industriezweige berichtet. Alle führenden Hersteller und Dienstleister auf diesem Gebiet sind vertreten.

Tagungsort:

FH Münster
Technologiecampus Steinfurt
Gebäude S
Stegerwaldstraße 39
48565 Steinfurt

Organisation

Prof. Dr. M. Kreyenschmidt
M. Sc. S. Hanning
Dr. J. Flock
Dr. E. Pappert

Informationen und Online-Anmeldung unter FH.MS\AWT

Kontakt:

M. Sc. Stephanie Hanning

FH Münster
Fachbereich Chemieingenieurwesen
Instrumentelle Analytik
Stegerwaldstr. 39
48565 Steinfurt
Fax 02551 962 429
E-Mail awt@fh-muenster.de

Die Veranstaltung beginnt an beiden Tagen um 9 Uhr.

Die Vorträge werden nach Abschluss der Veranstaltung für alle angemeldeten Teilnehmer zum Download bereitgestellt.

03. März 2026 ab 9 Uhr

Heinz-Gerd Joosten

Funke versus Laser: Status quo und Versuch eines Ausblicks

Martin Tillemann (TAZ)

Warum der DAkkS Kalibrierschein nicht nur für den Auditor wichtig ist – Überraschungen am Funkenspektrometer

Stefan Wieler (QUAISO)

DIN EN ISO/IEC 17025 im Fokus: Herausforderungen bei der Akkreditierung der Funkenemissionsspektrometrie und Röntgenfluoreszenzanalyse

Philipp Gründkern (SciApp)

Flüssigkeitsanalytik mittels HH-LIBS: LAC und LSC

Wilhelm Sanders (Thermo Fisher Scientific)

Verbesserung der analytischen Leistungsfähigkeit bei der Metallcharakterisierung mit der „Massbox“-Technologie

Gero Sinha (SUS Nell)

Die Evolution der Rekalibrierproben

Niklas Willems (KETEK)

Neueste Entwicklungen bei Silizium-Drift-Detektoren und Anwendungsbeispiele

Adrian Fiege (Bruker)

Eine kleine Revolution für WD-RFA: Neue Detektoren und Signalverarbeitung für Geschwindigkeit

Jonas Lauer-Heck (Institut für Arbeitsschutz DGUV)

TXRF im Arbeitsschutz - Spurenanalyse von Cu, Zn, Pb, Mn, Cr, Co und Ni in der Luft am Arbeitsplatz

Tobias Gantenberg (Hochschule Niederrhein)

Feinstaubanalytik von Emissionen in verschiedenen Anwendungsbereichen und Präzision

Saskia Kerkeling (FH Münster)

Ortsaufgelöste Analyse von PVC-Materialien

Reza Hosseinabadi (Hitachi)

Einfluss der Probenvorbereitung auf Messergebnisse von Handheld-RFA-Geräten im Feld

Frederic Davidts (XRF Scientific)

XRF analysis & Loss of Ignition (LOI)

Markus Krämer (Axxo Dresden)

Röntgenfluoreszenz im Streiflicht – Mit GIXRF von der Oberfläche bis in Nanometer-Tiefe

Jonathan M. Kranz (TU Berlin)

Optimierte Polykapillarlinsen für hochaufgelöste full-field RFA

04. März 2026 ab 9 Uhr

Martin Lischka (Herzog Maschinenfabrik)

Sensoroptimierte Probenvorbereitung für die XRF

Dirk Töwe (HRT)

Effiziente Probenvorbereitung für die RFA-Analytik

Rainer Schramm (Fluxana)

Schmelzaufschluss – Weiterentwicklung für die Zukunft

Dirk Wissmann (Spectro**)**

Analyse von Magneten, Einsatz der ED-RFA in der Qualitätskontrolle und beim Recycling

Benjamin Thomas (Shimadzu)

Bestimmung von Fluor in Schlacke mittels Energie-dispersiver Röntgenfluoreszenzspektroskopie

Yasemin Oguz (Hochschule Niederrhein)

Schwertmetalle und Mikroplastik in Getreide

Volker Hückelkamp (Spectro)

ED-RFA im Einsatz bei der Optimierung elektrolytischer Raffinationsprozesse und galvanischer Bäder

Daniel Sachtler (Malvern Pananalytical)

Präzisionsanalytik von Edelmetallen mit der RFA

Ernst Hinteregger (Treibacher)

Selten? Aber sicher nicht bei uns! - Aspekte bei der Analyse von Seltenen Erden und Actinoide

Jan Stelling (Bruker)

Wie neue Wege der WD-RFA-Datenauswertung konventionelle Methoden vereinfachen und beschleunigen

Jürgen Schram (Hochschule Niederrhein)

Analytik in antiquarischen Büchern

Oleksandra Marushchenko (Helmholtz-Zentrum Berlin)

Wie Zink in Zähnen wandert - Einblicke mittels RFA auf verschiedenen Längenskalen

Ling Schneider (Thermo Fisher Scientific)

Boosting efficiency in Elemental Analysis with the ARL X900 spectrometer: Precision, Speed, and Reliability

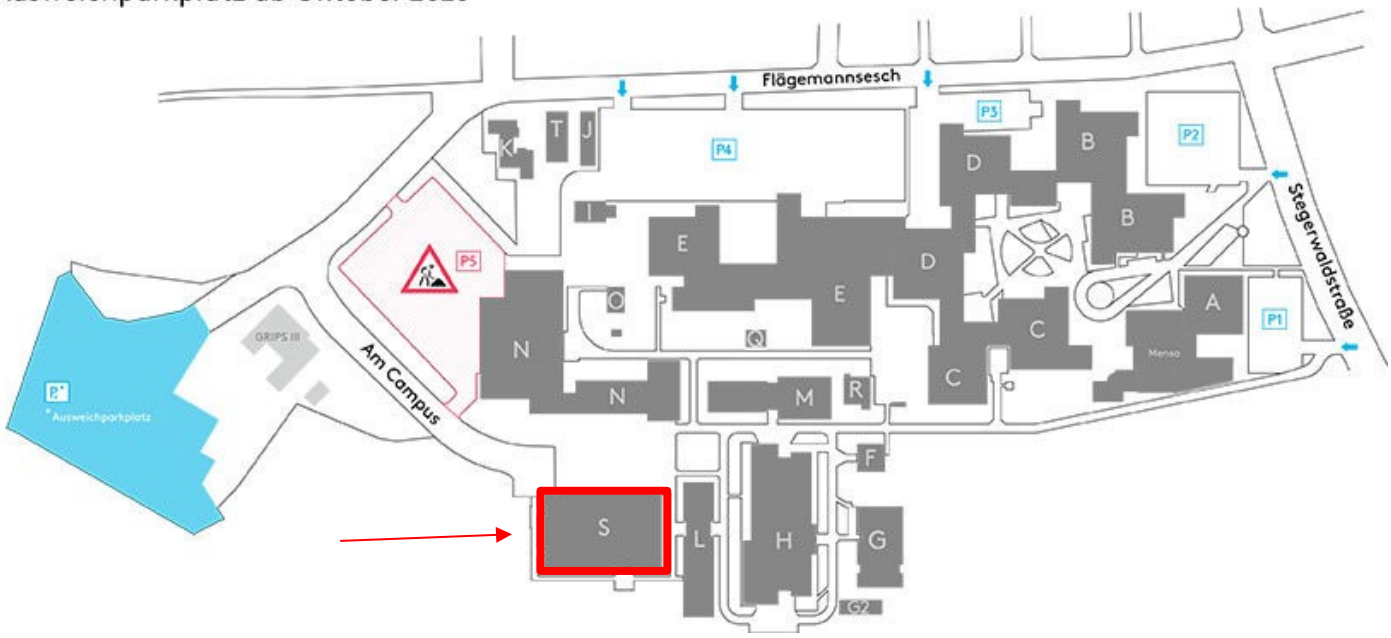
Anfahrtsbeschreibung

Das AWT findet am Technologie-Campus Steinfurt der FH Münster statt. Die Lage der Parkplätze (P1-P5, Ersatzparkplätze) und des Veranstaltungsgebäudes (Gebäude S) entnehmen Sie bitte dem Lageplan und der Ausschilderung vor Ort.
Sollten Sie mit dem Zug anreisen, gibt es einen Bustransfer vom Bahnhof Steinfurt zum Campus an der Stegerwaldstraße. Der Fußweg vom Bahnhof bis zum Campus beträgt ca. 7 Minuten.

Abendveranstaltung:

Traditionell treffen wir uns zu einem „Get-together“ am ersten Abend des AWT in einer Steinfurter Gastronomie. Bitte melden Sie sich gerne an der Anmeldung dazu an.

Campus Steinfurt (CST)
Stegerwaldstraße 39, 48565 Steinfurt
Ausweichparkplatz ab Oktober 2023



Aktuelle Informationen finden Sie unter: FH.MS\AWT